OBSAH

1 ÚVOD 5
1.1 FORMULACE PROBLÉMU 5
1.2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 6
1.3 CÍLE DISERTACE 10
2 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 11
2.1 ZESÍLENÍ GOOSOVA-HÄNCHENOVÉ POSUVU 11
2.2 METODA SINGULÁRNÍHO SPEKTRÁLNÍHO INDEXU LOMU 12
2.3 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTVY 14
3 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 15
3.1 ZESÍLENÍ GOOSOVA-HÄNCHENOVÉ POSUVU PRO TE A TM MÓDY 15
3.2 METODA SINGULÁRNÍHO SPEKTRÁLNÍHO INDEXU LOMU 17
3.3 VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PARAMETRŮ MIKROSKOPU 19
3.3.1 Vliv vzdálenosti hrot sondy – povrch vzorku 19
3.3.2 Měření tloušťky tenké dielektrické vrstvy 20
4 ZÁVĚR 22
5 REFERENCE 24
6 VLASTNÍ PUBLIKACE 25
7 CURRICULUM VITAE 29
8 ABSTRACT 30